

3D-Lasermikroskop

VK-X100 series

(Keyence Deutschland GmbH)

Anwendung: Ultrafeine, berührungslose Profil-, Rauheits- und Schichtdickenmessungen



- Materialunabhängig
- Auflösung im Nanometerbereich
- 5x, 10x, 20x und 50x-Objektive
- Schnelle präzise 3D-Messung
- Analysieren eines größeren Bereichs durch Bilderzusammensetzung
- Scharfe Farbbilder bei hoher Auflösung und hoher Vergrößerung